



EVALUATION OF PRECISION MEASURING OF RESIDUAL STRESSES.

ZHODNOTENIE PRESNOSTI MERANIA ZVÝŠKOVÝCH NAPÄTIÍ.

Kubík Ľ.

This paper values an accuracy of measuring of residual stresses in the bend beam measured by holographic interferometry. The comparison of the difference method, the cubic spline method and the regression method and method of derivative is discussed.

Keywords: residual stress, holographic interferometry, accuracy

Pri určovaní napäťí v povrchovej časti objektov metódou holografickej interferometrie sa zvyčajne postupuje tak, že príslušnou metódou sú najprv zmerané posunutia na deformovanom povrchu objektu, a potom sú matematicky spracované na zodpovedajúce napäťia. Z teórie pružnosti vyplýva, že príslušné pomerné deformácie resp. napäťia principiálne získame ako prvú resp. druhú deriváciu posunutia podľa príslušného smeru [1],[2].

Na diferencovanie experimentálne nameraných posunutí sa využíva viac metód. Jednou z nich je diferenčná metóda [1]. Spracúva diskrétnie hodnoty posunutí. Táto metóda je nepresná [1],[2].

Viac rozšírené sú numerické metódy s využitím Newtonovho alebo Lagrangeovho polynomu alebo metóda kubických splajnov. Posledná metóda je považovaná za najpresnejšiu [2]. Treba ju však z viacerých dôvodov využívať s určitou opatrnosťou [1]. Najjednoduchšou a v mnohých prípadoch najpresnejšou metódou je však metóda nájdenia najvhodnejšej approximačnej funkcie metódou regresie a jej následná priama derivácia. Nevhodou tejto metódy je, že na zložitejších zdeformovaných objektoch zvyčajne takúto jednoduchú funkciu, vhodnú na priame derivovanie, nemusíme vôbec nájsť. Tým sa táto metóda obmedzuje len na jednoduché objekty

a spôsoby zatažení.

V našej práci hodnotíme presnosť merania zvyškových napäti pri využití holografickej interferometrie a uvádzame porovnanie differenčnej metódy, metódy kubických splajnov a metódy regresie a následného derivovania.

Differenčná metóda je dostatočne popísaná v [1]. Krajná chyba určenia druhej derivácie je daná podľa [1], [5] vzťahom:

$$\mathcal{H}(y_t'') = \frac{d}{dh_t} (y_t'') \cdot \mathcal{H}(h_t) + \frac{d}{dy_t} (y_t'') \cdot \mathcal{H}(y_t) \quad (1)$$

kde $h_t = x_{t+1} - x_t$, y_t je veľkosť posunutia a x_t je poloha posunutí vzhľadom na počiatok súradnicovej sústavy.

Metóda kubických splajnov je popísaná napr. v [2]. Hľadané derivácie v uzloch siete dostaneme ako riešenie Z_t systému lineárnych algebraických rovnic. Hodnoty v krajných bodech určíme extrapoláciou. Pre výpočet vyšších derivácií sa celý postup opakuje. Chyba metódy je daná chybou riešenia lineárneho systému rovnic. Krajná chyba prvej derivácie je určená vzťahom:

$$\mathcal{H}(Z_t) = 3,3725 \cdot s(Z_t) \quad (2)$$

kde $s(Z_t)$ je stredná kvadratická odchyľka jednotlivých derivácií Z_t . Krajnú chybu druhej derivácie získame opakováním predchádzajúceho postupu.

Tabuľku experimentálne nameraných bodov najlepšie aproximujeme metódou matematickej regresie [3]. Metódy regresnej analýzy sú popísané napr. v [6], [7], [8]. Aproximačnú funkciu zderivujeme a opäť regresne vyhľadíme. Krajná chyba, ktorú vnáša v tomto prípade dvojnásobné derivovanie je daná podľa [4] vzťahom:

$$\mathcal{H}(f''(x_1 + \mathcal{H}(x_1), x_2 + \mathcal{H}(x_2), \dots) = (\mathcal{H}(x_1) \frac{d}{dx_1} + \mathcal{H}(x_2) \frac{d}{dx_2} \dots) f''(x_1, x_2, \dots)$$

kde x_t sú jednotlivé parametre funkcie a $\mathcal{H}(x_t)$ sú krajné chyby týchto parametrov.

Problém sme analyzovali na konkrétnom prípade merania zvyškových napäti vo votknutej medenej tyči o rozmeroch (250x24x3) mm, zataženej na konci priečou silou. Vytvorenie zvyškových napäti v tyči bolo spôsobené zatažením a nasledovným odiahčením voľného konca votknutej tyče počas 10s silou 15N. Posunutia boli určené metódou holografickej interferometrie pri využití metódy reálneho času [2]. Priebeh posunutí y_t vzhľadom na pozdĺžnu os tyče x je zobrazený na

obr.1.Závislosť bola vytvorená uplatnením aproximačnej funkcie $y=ax^b$ s koeficientom korelácie 0,999 a s koeficientami $a=2,057 \cdot 10^{-4}m$, $b=1,359$,krajná chyba určenia a , $\mathcal{R}(a)=5,348 \cdot 10^{-6}m$, $\mathcal{R}(a)_x=2,6\%$,krajná chyba určenia b , $\mathcal{R}(b)=2,454 \cdot 10^{-2}$, $\mathcal{R}(b)_x=1,8\%$,krajná chyba meraného posunutia vznikajúca v dôsledku regresie je $\mathcal{R}(y_1)=0,253 \cdot 10^{-6}m$.Krajná chyba pre posunutia vyplývajúca z experimentálnych podmienok je podľa [2] ,[4] $\mathcal{R}(y_1)=0,34 \cdot 10^{-6}m$.Pre jednotlivé posunutia sa pohybuje v rozsahu od 3% do 40%.Pre posunutia menšie ako $1\mu m$ však presahuje 100%-né hodnoty.Celková krajná chyba posunutí je súčet regresnej chyby a chyby experimentu.Jej hodnota je $0,593 \cdot 10^{-6}m$.Relatívna chyba sa pohybuje od 5,8% do 48%.

Pretože veľkosť plasticických deformácií vytvárajúcich sa v tyči je veími malá,pre získanie maximálnych napäť v krajných vláknoch využijeme vzťahy popisujúce pružný ohyb tyče [9].Pre zvyškové deformácie môžeme pre krajné vlákna tyče potom písat'

$$\varepsilon_{zv} = \frac{h}{2} \frac{d^2y}{dx^2} \quad (3)$$

kde h je hrúbka tyče a x je os symetrie.

V práci sa nezaoberáme vplyvom ,ktorý vnáša modul pružnosti a používame tabuľkovú hodnotu $1,23 \cdot 10^{11} Pa$ [10].

Priebeh zvyškových napäť v závislosti od polohy na tyči x získany diferenčnou metódou z nevyhľadených hodnôt posunutí je na obr.2.Krajná chyba zvyškových napäť daná chybou dvojnásobného derivovania je podľa vzťahu (1) $10^3\% - 10^4\%$,pričom $\mathcal{R}(h_1)=10^{-3}m$ a $\mathcal{R}(y_1)=34 \cdot 10^{-8}m$.Priebeh je approximovaný lineárnom priamkovou regresiou s krajnou chybou regresie 3%-30%.Celková chyba je teda rádoive $10^3\%-10^4\%$.

Na obr.3 je ten istý prípad, lenže sa vychádzalo z vyhľadených hodnôt posunutí.Krajná chyba je taká istá ako v predchádzajúcom prípade.

Na obr.4 je priebeh zvyškových napäť získaných metódou splajnov z nevyhľadených hodnôt posunutí.Krajná chyba zvyškových napäť je podľa vzťahou (2) 130%.Priebeh je approximovaný priamkou s krajnou chybou regresie 63%-126%.Celková chyba napäť je 193%-256%.

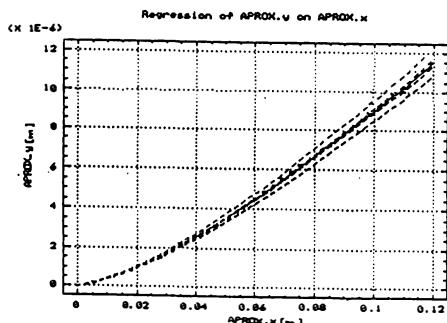
Na obr.5 je ten istý prípad ,no vychádzalo sa z vyhľadených posunutí.Krajná chyba metódy splajnov je 130%.Priebeh je approximovaný mocninovou funkciou s krajnou chybou regresie 10%-75%.Celková chyba má hodnotu 140%-205%.

Na obr.6 je priebeh zvyškových napäť v závislosti od polohy na tyči x určený priamou deriváciou a ich vyhľadením mocninovou funkciou.Krajná chyba napäť vyplývajúca z metódy

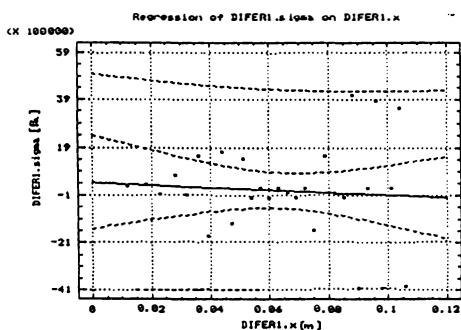
je 2%-8%. Chyba regresie je 0,4%. Celková chyba napäti je 2,4%-8,4%.

V každom grafe je čiarkovanou čiarou vymedzená oblasť 95% výskytu strednej chyby regresie.

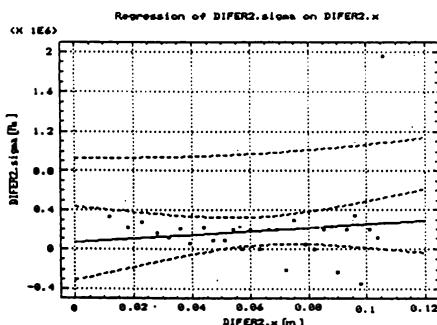
Najvhodnejšou metódou sa ukázala byť metóda priamej derivácie posunutí. Splajny sú vhodné len v prípadoch keď sa spracúvajú vyhľadené experimentálne hodnoty. Diferenčná metóda je v tomto prípade nevhodná na použitie. Splajny a priama derivácia dávajú zhodné hodnoty napäti. Priebeh napäti má charakter teoretického priebehu napäti vo votknutej tyči pri pružnom ohybe.



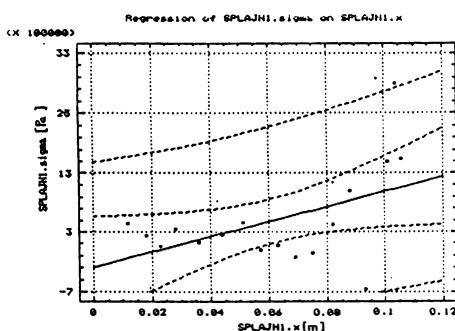
Obr.1.Priebeh posunutí v závislosti na pozdišiu os tyče x.



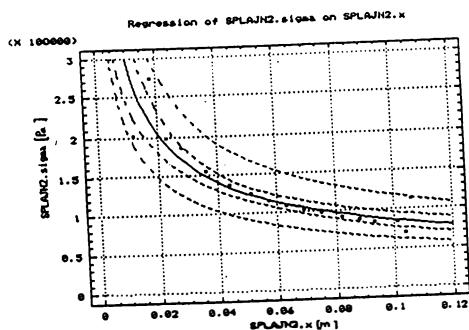
Obr.2.Priebeh napäti sigma určených diferenčnou metódou z nevyhľadených posunutí,vzájomne na pozdišiu os tyče x.



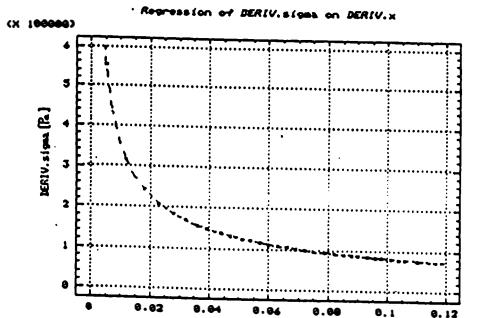
Obr.3.Pribeh napeti sigma,urcenych differencou metodu z vzhledenych posunuti,vzhadom na pozidnu os tyce x.



Obr.4.Pribeh napeti sigma,urcenych metodou splajnov z nevzhledenych posunuti,vzhadom na pozidnu os tyce x.



Obr.5.Pribeh napeti sigma,urcenych metodou splajnov z vzhledenych posunuti,vzhadom na pozidnu os tyce x.



Obr. 6. Priebeh napätia signálu určených metodou priamej derivácie, vzhľadom na pozíciu os trócie x.

Literatúra:

- [1] Vest,Ch.: Holographic interferometry. New York 1979 (ruský preklad: Golografičeskaja interferometrija, Moskva, Mir 1982).
- [2] Baláš,J.-Szabó,V.: Holografická interferometria v experimentálnej mechanike. Bratislava, VEDA, 1986.
- [3] Strečko,O.: Desať kapitol z numerických grafických a iných metód. Bratislava, Alfa 1979.
- [4] Brož,J.: Základy fyzikálních měření I. Praha, SPN 1983.
- [5] Kubíček,M.: Numerické algoritmy řešení chemicko-inženýrských úloh. Praha, Alfa, SNTL 1983.
- [6] Dowdy,S.-Warden,S.: Statistics for Research, New York, John Wiley&Sons 1983.
- [7] Zvára,K.: Regresní analýza. Praha, Academia 1989.
- [8] Rektorys,K.: Přehled užité matematiky. Praha, SNTL 1963.
- [9] Kostin,V.: Postrojenije diagram mikroplastičesko deformatirovaniya pri izgibe s ispol'zovaniem metoda golografičeskoy interferometriji. Problemi pročnosti, 1988, č.4, str.111-114.
- [10] Brož,J.: Fyzikální a matematické tabuáky. Praha, SNTL 1980.

RNDr. Ľubomír Kubík, Katedra mechaniky a fyziky, MF, VŠP Nitra, Gaguova 17, PSČ 949 76, tel. 087/414 330, k. 203, fax. 087/417 003